

学振 175 委員会 信頼性・システム技術分科会主催
第 4 回 信頼性・システム技術研究会 開催のお知らせ

2012 年 7 月 18 日
信頼性・システム技術分科会 幹事

学振 175 委員会 会員各位,

下記日程にて、第 4 回 信頼性・システム技術研究会を開催する運びとなりました。
今回も信頼性と火災時のリスク等を中心に、講師の方々から幅広く情報提供いただき、皆様と一緒に PV の維持管理方法や太陽電池モジュールの信頼性について議論したいと思います。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

なお、当日は、11 時より東工大 EEI 棟(環境エネルギーイノベーション棟)の見学会を開催します。太陽電池・燃料電池等のエネルギー機器を導入した、新しい研究棟です。ご希望の方は併せてお申し込み下さい。

日時:2012 年 8 月 8 日(水) 13 時~17 時 30 分
場所:東京工業大学 蔵前会館 (3 階 手島精一記念会議室)
<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html>

EEI 棟見学会 集合場所:東京工業大学 蔵前会館 1F ロビー(11 時集合)

参加費:無料

参加資格:

学振 175 委員会 委員, 委員代理, および委員の所属する組織において信頼性・システム技術に携わる方

- * 1:同一組織から複数名の参加を認めます
- * 2:学界委員には交通費を支給します(希望者のみ)

参加申込先:下記のリンク先から登録ください。
<http://staff.aist.go.jp/takashi.oozeki/gakushin175.html>

上手く登録できないときは 分科会幹事まで。
ueda.y.ae@m.titech.ac.jp (東工大 植田)

申込締切り:8 月 6 日(月)

スケジュール(予定):

- 11:00～12:00 EEI 棟見学会
- 13:00～13:05 (5分) 分科会委員長挨拶
- 13:05～13:20 (15分) 前回までのまとめ・第3回 事後アンケート結果報告(幹事)
- 13:20～13:50 (30分) 太陽電池のPIDまとめ(エスペック, 棚橋様)
- 13:50～14:05 (15分) JEMAの安全性に関する取組(JEMA, 吉川様)
- 14:05～14:30 (25分) 太陽光発電向けバイパスダイオードにおける規格と特性について(新電元工業, 佐藤様)
- 14:30～14:45 (15分) 休憩
- 14:45～15:05 (20分) NEDO FT 事業における保守の実態調査結果(三菱総研, 岩崎様)
- 15:05～15:25 (20分) 消防研の実験; 火炎や照明での電圧発生((消防研, 田村様)
- 15:25～16:05 (40分) 火災保険の基礎と引受について(NK S J リスクマネジメント, 土師様)
- 16:05～16:20 (15分) 休憩
- 16:20～17:20 (60分) パネル討論
 パネラー; 各講師, 吉富政宣氏, 加藤和彦(分科会委員長)
- 17:25～17:30 (5分) まとめ, 事務連絡

本分科会は太陽電池モジュール・太陽光発電システムの信頼性に焦点を当て、研究会などを通じて調査・研究の最新動向や関連情報の共有化を推進する事を目的としております。委員の皆様に加え、システム技術や信頼性に携わる方のご参加を歓迎いたします。

以上